

Docket No.: W&B-INF-908

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : JUSTUS KUHN ET AL.  
Filed : CONCURRENTLY HEREWITH  
Title : DEVICE AND METHOD FOR REDUCING THE NUMBER OF  
ADDRESSES OF FAULTY MEMORY CELLS

JC580 U.S. PTO  
10/016863  
12/14/01

CLAIM FOR PRIORITY

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119,  
based upon the German Patent Application 100 62 404.9, filed December 14, 2000.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted  
herewith.

Respectfully submitted,



For Applicants

WERNER H. STEMER  
REG. NO. 34,956

Date: December 14, 2001

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100  
Fax: (954) 925-1101

/kf



JCS80 U.S. PTO  
10/016863  
12/14/01

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

**Aktenzeichen:** 100 62 404.9  
**Anmeldetag:** 14. Dezember 2000  
**Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG,  
München/DE  
**Bezeichnung:** Vorrichtung und Verfahren zum Reduzieren  
der Anzahl von Adressen fehlerhafter Speicher-  
zellen  
**IPC:** G 11 C 29/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. November 2001  
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Waliner

## Beschreibung

### Vorrichtung und Verfahren zum Reduzieren der Anzahl von Adressen fehlerhafter Speicherzellen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum  
5 Reduzieren von Adressen fehlerhafter Speicherzellen einer  
Speicheranordnung, die bei einer Prüfung der Speicheran-  
ordnung auf eine korrekte Funktionsfähigkeit der Speicherzel-  
len ermittelt werden. Die Vorrichtung und das Verfahren wer-  
den insbesondere bei einem Halbleiterspeicher mit einem ma-  
10 trixförmig angeordneten Speicherzellenfeld eingesetzt.

Bei der Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Speicherzellen  
eines Halbleiterspeichers wird aufgrund der großen Anzahl der  
Speicherzellen eine große Anzahl von Adressen ermittelt, die  
fehlerhafte Speicherzellen kennzeichnen. Die große Anzahl der  
15 Adressen erfordert einen großen Speicherbereich und einen  
großen Aufwand bei der Abspeicherung und Weiterverarbeitung  
der Adressen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren und  
eine Vorrichtung bereitzustellen, bei dem die Anzahl der  
20 Adressen fehlerhafter Speicherzellen, die abzuspeichern und  
weiterzuverarbeiten ist, verkleinert wird.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch das Verfahren gemäß den  
Merkmale des Anspruchs 1 und durch die Vorrichtung gemäß den  
Merkmale des Anspruchs 6 gelöst.

25 Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die Adressen  
von Speicherzellen, die bei einem Testverfahren als fehler-  
haft erkannt wurden, als erste Fehleradressen weiterverarbei-  
tet werden und in einem ersten Vergleichsverfahren mit zwei-  
ten Fehleradressen verglichen werden. Die zweiten Fehler-  
30 adressen stellen Adressen von vollständig zu reparierenden  
Wort- und/oder Bitleitungsabschnitten dar. Mit Wort- bzw.

Bitleitungsabschnitten sind die Bereiche einer Wort- bzw. Bitleitung gemeint, die üblicherweise komplett ersetzt werden oder ersetzt werden müssen.

5 Ergibt der Vergleich im ersten Vergleichsverfahren, dass die ersten Fehleradressen und die zweiten Fehleradressen übereinstimmen, so werden die ersten Fehleradressen nicht mehr weiterverarbeitet und vorzugsweise gelöscht.

10 Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Vorzugsweise werden die ersten Fehleradressen, die beim ersten Vergleichsverfahren nicht mit den zweiten Fehleradressen übereinstimmen, jeweils für einen Wort- und/oder Bitleitungsabschnitt dahingehend überprüft, ob pro Wort- und/oder Bitleitungsabschnitt eine vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen überschritten  
15 wird. Ist dies der Fall, so wird der entsprechende Wort- und/oder Bitleitungsabschnitt als vollständig zu reparieren-der Wort- und/oder Bitleitungsabschnitt erkannt und in weiteren ersten Vergleichsverfahren als neue zweite Fehleradresse berücksichtigt. Auf diese Weise werden laufend die  
20 zweiten Fehleradressen aktualisiert und somit laufend die zu speichernden und weiterzuverarbeitenden ersten Fehleradressen reduziert.

25 Vorzugsweise wird als erste Fehleradresse eine komplette Adresse (eine Bitadresse und eine Wortadresse) einer fehlerhaften Speicherzelle verwendet.

30 Je nach Ausführungsform der zu überprüfenden Speicheranordnung ist die vorgebbare Anzahl von Adressen fehlerhafter Speicherzellen für das zweite Vergleichsverfahren für die Wort- und Bitleitungsabschnitte unterschiedlich groß. Auf diese Weise kann das erfindungsgemäße Verfahren an die für einen Wort- und Bitleitungsabschnitt unterschiedlich große Anzahl von Ersatzbitleitungsabschnitten bzw. Ersatzwortleitungsabschnitten angepasst werden.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden mehrere Bitleitungen, die zu einem Bitleitungsblock zusammengefasst sind, mit einer einzigen Bitblockadresse gekennzeichnet. Auf diese Weise wird die Anzahl der ersten Fehleradressen reduziert. Somit wird das Verfahren vereinfacht.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform werden mehrere Wortleitungen in einem Wortleitungsblock zusammengefasst und mit einer Wortblockadresse gekennzeichnet. Auf diese Weise wird die Anzahl der ersten und zweiten Fehleradressen für Wortleitungen reduziert. Dadurch ist das erfindungsgemäße Verfahren vereinfacht und schneller abarbeitbar.

Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung besteht in der Verwendung einer ersten Vergleichseinheit mit zwei Reihen von Registern, in denen das erste Vergleichsverfahren durchgeführt wird.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 einen schematischen Verfahrensablauf zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens und

Fig. 3 einen Ausschnitt aus einer Speicheranordnung mit einem Bitleitungsblock und einem Wortleitungsblock.

Fig. 1 zeigt eine Speicheranordnung 3, die über eine Testleitung 2 mit einer Testvorrichtung 1 verbunden ist. Die Speicheranordnung 3 weist einen Ausgang auf, der über eine erste Ausgangsleitung 8 mit einer Einheit 7 in Verbindung steht. Die Speicheranordnung 3 weist einen Takteingang 36 auf, der an einen Taktausgang 38 eines Taktgenerators 37 angeschlossen ist. Die Testleitung 2 ist weiterhin an einen ersten Multiplexer 4 angeschlossen.

Der erste Multiplexer 4 weist zwei Ausgänge auf, wobei ein Ausgang an einen Eingang eines ersten Adressregisters 5 und ein weiterer Ausgang an einen Eingang eines zweiten Adressregisters 6 angeschlossen ist. Das erste Adressregister 5 steht über einen Ausgang mit der Einheit 7 in Verbindung. Das zweite Adressregister 6 steht ebenfalls über einen Ausgang mit einem weiteren Eingang der Einheit 7 in Verbindung. Die Einheit 7 ist mit einem Ausgang an eine erste Reihe 9 von seriell geschalteten Registern 11, 12, 13, 14 angeschlossen. Die erste Reihe 9 weist ein erstes, zweites, drittes und viertes Register 11, 12, 13, 14 auf. Das vierte Register 14 der ersten Reihe 9 steht über einen Ausgang mit einem zweiten Multiplexer 19 in Verbindung.

Weiterhin ist eine zweite Reihe 10 mit einem fünften, sechsten, siebten, achten Register 15, 16, 17, 18 vorgesehen. Die Register 15, 16, 17, 18 der zweiten Reihe 10 sind ebenfalls in Serie geschaltet. Zwischen der ersten und der zweiten Reihe 9, 10 ist eine erste Vergleichseinheit 20 angeordnet, die mit allen Registern der ersten und der zweiten Reihe 9, 10 verbunden ist. Die erste Vergleichseinheit 20 weist einen ersten Ausgang 40, einen ersten Eingang 39 und einen Takteingang 36 auf.

Weiterhin ist eine Recheneinheit 51 vorgesehen, die über eine Datenleitung 50 mit einem Speicher 47 und mit einem siebten Ausgang 52 mit dem ersten Eingang 39 der ersten Vergleichseinheit 20 verbunden ist.

Der zweite Multiplexer 19 weist einen Takteingang 36 und zwei Ausgänge auf, die zu einer vierten Reihe 22 und zu einer fünften Reihe 33 von Registern 27, 28, 29, 30, 35 geführt sind. Die vierte Reihe 22 weist ein neuntes, zehntes, elftes und zwölftes Register 27, 28, 29, 30 auf. Der vierten Reihe 22 ist eine zweite Vergleichseinheit 31 zugeordnet, die mit allen Registern der vierten Reihe 22 verbunden ist. Die Register der vierten Reihe 22 sind seriell geschaltet.

Weiterhin ist eine dritte Reihe 21 mit einem dreizehnten Register 23, einem vierzehnten Register 24, einem fünfzehnten Register 25 und einem sechzehnten Register 26 angeordnet.

5 Die zweite Vergleichseinheit 31 ist mit allen Registern der dritten und vierten Reihe 21, 22 verbunden. Die zweite Vergleichseinheit 31 weist einen Takteingang 36, einen zweiten Eingang 41 und einen zweiten Ausgang 42 auf.

10 Die fünfte Reihe 33 ist mit den vier Registern 35 entsprechend der vierten Reihe 22 aufgebaut. Weiterhin ist eine sechste Reihe 34 mit vier Registern 35 angeordnet, die entsprechend der dritten Reihe 21 aufgebaut ist. Die Register 35 der fünften und sechsten Reihe 33, 34 sind mit einer dritten Vergleichseinheit 32 verbunden, die einen Takteingang 36, einen dritten Eingang 43 und einen dritten Ausgang 44 aufweist.

15 Die Anordnung der fünften und sechsten Reihe 33, 34 mit der dritten Vergleichseinheit 32 ist analog in der Anordnung und in der Funktionsweise zu der Anordnung der dritten und vierten Reihe 21, 22 mit der zweiten Vergleichseinheit 31, wobei im Folgenden die Erfindung nur anhand der dritten und vierten

20 Reihe 21, 22 beschrieben wird.

Die Recheneinheit 51 ist mit einem achten Ausgang 53 an den zweiten Eingang 41 der zweiten Vergleichseinheit 31 angeschlossen. Weiterhin weist die Recheneinheit 51 einen neunten Ausgang 54 auf, der an den dritten Eingang 43 der dritten

25 Vergleichseinheit 32 angeschlossen ist.

Der Taktgenerator 37 weist einen Taktausgang 38 auf, der an die Takteingänge 36 angeschlossen ist und eine Referenzzeit vorgibt.

30 Im Folgenden wird die Funktionsweise der Vorrichtung der Fig. 1 näher erläutert. Die Testvorrichtung 1 gibt über die Testleitung 2 seriell Spalten- und Zeilenadressen von Speicherzellen der Speicheranordnung 3 an die Speicheranordnung 3,

die auf eine korrekte Funktionsweise hin zu überprüfen sind. Die Art der zu überprüfenden Funktion wird von der Testvorrichtung 1 über entsprechende Steuersignale vorgegeben. Die Überprüfung der korrekten Funktionsweise der adressierten Speicherzellen wird in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel von der Speicheranordnung 3 durch Testschaltungen 61 selbst durchgeführt. Ergibt die Überprüfung der Speicherzelle, die durch die Adresse der Wort- oder Bitleitung gekennzeichnet ist, dass die Speicherzelle fehlerhaft ist, so wird von der Testschaltung 61 über die erste Ausgangsleitung 8 ein Fehler-signal an die Einheit 7 weitergegeben. Parallel zur Überprüfung der adressierten Speicherzelle werden die Wort- und Bitadressen von der Testleitung 2 an den ersten Multiplexer 4 weitergegeben. Der erste Multiplexer 4 führt die Wortadressen zum ersten Adressregister 5 und die Bitadressen zum zweiten Adressregister 6. Das erste und das zweite Adressregister 5, 6 sind als Schieberegister mit einstellbarer Tiefe ausgebildet. Die Adressen der Wort- und Bitleitungen werden in der Weise synchron mit der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der adressierten Speicherzellen weiterverarbeitet, dass immer die entsprechende Adresse der Wort- und Bitleitung an dem Eingang der Einheit 7 anliegt, wenn das entsprechende Signal für eine korrekte Funktionsfähigkeit oder für eine fehlerhafte Funktionsfähigkeit an die Einheit 7 gegeben wird. Erhält die Einheit 7 beispielsweise bei einer anliegenden Wort- und Bit-adresse über die erste Ausgangsleitung 8 die Information, dass die Speicherzelle, die mit der Wort- und Bitadresse gekennzeichnet ist, korrekt funktioniert, so werden die Wort- und Bitadresse im ersten bzw. zweiten Adressregister 5, 6 gelöscht. Wird jedoch über die erste Ausgangsleitung 8 ein Fehlersignal an die Einheit 7 gegeben, so gibt die Einheit 7 beim nächsten Taktsignal die am Eingang anliegende Wort- und Bitadresse über einen zwölften Ausgang 62 an das erste Register 11 der ersten Reihe 9 weiter. Die Wort- und Bitadresse wird von der ersten Vergleichseinheit 20 weiterverarbeitet.

Im fünften Register der zweiten Reihe 10 ist beispielsweise eine Wortleitungsabschnittadresse (Wort- und Bitadresse) einer vollständig zu reparierenden Wortleitung, eine so genannte zweite Fehleradresse, abgespeichert. Die erste Vergleichseinheit 20 vergleicht die Adresse des ersten Registers 11 mit der Adresse des fünften Registers 15. Ergibt der Vergleich, dass die Adressen übereinstimmen, so wird die Adresse des ersten Registers 11 von der ersten Vergleichseinheit 20 gelöscht. Ergibt jedoch der Vergleich, dass die Adressen des ersten und des fünften Registers nicht übereinstimmen, so wird die Adresse des ersten Registers 11 nicht von der ersten Vergleichseinheit 20 gelöscht, sondern bei dem nächsten Taktsignal in das zweite Register 12 weitergeschoben. Gleichzeitig wird beim nächsten Taktsignal von der Einheit 7 eine entsprechende Adresse in das erste Register 11 eingelesen, wenn für diese Adresse ein Fehlersignal an der ersten Ausgangsleitung 8 an der Einheit 7 anliegt.

Die erste Vergleichseinheit 20 vergleicht zwischen zwei Taktsignalen jeweils den Inhalt des ersten Registers mit dem Inhalt des fünften Registers, den Inhalt des zweiten Registers 12 mit dem Inhalt des sechsten Registers 16, den Inhalt des dritten Registers 13 mit dem Inhalt des siebten Registers 17 und den Inhalt des vierten Registers 14 mit dem Inhalt des achten Registers 18. Ergibt der Vergleich, dass die Adresse des Registers der ersten Reihe mit der Adresse des entsprechenden Registers der zweiten Reihe 10 übereinstimmt, so wird die Adresse des Registers der ersten Reihe 9 gelöscht.

Nach jedem Taktsignal wird die Adresse in der ersten Reihe 9 um ein Register weiter verschoben. Vom vierten Register 14 wird die Adresse zu einem zweiten Multiplexer 19 weitergeleitet, der die Adresse in ein Register einer vierten oder fünften Reihe 22, 33 einschreibt.

In diesem Ausführungsbeispiel wird die Adresse vom vierten Register 14 über den zweiten Multiplexer 19 in ein neuntes Register 27 der vierten Reihe 22 eingeschrieben.

Bei dem folgenden Taktsignal vergleicht die zweite Vergleichseinheit 31 den Inhalt des neunten Registers 27 mit dem Inhalt des dreizehnten Registers 23, den Inhalt des zehnten Registers 28 mit dem Inhalt des vierzehnten Registers 24, den Inhalt des elften Registers 29 mit dem Inhalt des fünfzehnten Registers 25 und den Inhalt des zwölften Registers 30 mit dem Inhalt des sechzehnten Registers 26. Ergibt der Vergleich, dass die Adressen übereinstimmen, so wird der Inhalt des Registers 27, 28, 29, 30 der vierten Reihe 22 gelöscht. Ergibt der Vergleich, dass das Register der dritten Reihe 21 keinen Inhalt aufweist, so überträgt die zweite Vergleichseinheit 31 den Inhalt des zugeordneten Registers der vierten Reihe 22 in den Inhalt des entsprechenden Registers der dritten Reihe 21.

Bei jedem Taktsignal wird die Adresse, falls die Adresse nicht gelöscht oder in ein Register 23, 24, 25, 26 der dritten Reihe 21 verschoben wird, in der vierten Reihe 22 um ein Register 28, 29, 30 weitergeschoben.

Die Adressen können von der Testvorrichtung 1 jeweils Wortleitung für Wortleitung oder Bitleitung für Bitleitung oder Wortleitungsabschnitt für Wortleitungsabschnitt oder Bitleitungsabschnitt für Bitleitungsabschnitt oder beliebig getestet werden. Die Testvorrichtung 1 gibt an einem achten Eingang 63 der Recheneinheit 53 die Information aus, dass ein neuer redundanzkonformer Bitleitungs- oder Wortleitungsabschnitt getestet wird. Wahlweise überträgt die Testvorrichtung 1 an die Recheneinheit 51 die komplette Adresse des zu testenden Bit- oder Wortleitungsabschnittes. Die Recheneinheit 51 gibt ein entsprechendes Signal für den Beginn und das Ende der Überprüfung einer Wortleitung oder einer Bitleitung über den siebten, achten und neunten Ausgang 52, 53, 54 an die zweite und dritte Vergleichseinheit 31, 32.

Bei Erhalt des Signals, dass ein neuer Wort- oder Bit-  
leitungsabschnitt getestet wird, erhält die Einheit 7 von der  
Recheneinheit 51 ein entsprechendes Signal, so dass keine  
weiteren Adressen in die erste Reihe 9 eingelesen werden. An-  
schließend werden die bereits in der ersten Reihe 9 enthal-  
tenen Adressen durch die Register der ersten Reihe 9 gescho-  
ben, bis die letzte Adresse in der vierten Reihe 22 angelan-  
gt ist. Ist die letzte Adresse in der vierten Reihe 22 ange-  
langt, so schaltet der zweite Multiplexer 19 seinen Ausgang  
auf die fünfte Reihe 33 um. Anschließend werden alle Adressen  
bis zur letzten Adresse durch die Register der vierten Reihe  
22 geschoben und entsprechend dem oben beschriebenen Ver-  
fahren von der zweiten Vergleichseinheit 31 behandelt.

In einer vorteilhaften Ausführungsform findet beim Wechsel  
der Wort- oder Bitleitungsabschnitte kein Unterbrechen des  
Datenstroms der ersten Reihe 9 statt sondern der zweite Mul-  
tiplexer 19 wird auf den Datenstrom synchronisiert und schal-  
tet dann zwischen der vierten Reihe 22 und der fünften Reihe  
33 um, wenn die letzte Adresse des alten Wort- oder Bit-  
leitungsabschnittes in die vierte Reihe 22 übergeben wurde  
und die erste Adresse des neuen Wort- oder Bitleitungs-  
abschnittes sich noch in der ersten Reihe 9 befindet. An-  
schließend werden die Register der dritten und vierten Reihe,  
21, 22 auf den Wert 0 zurückgesetzt. Die Adressen des neu zu  
überprüfenden Wort- oder Bitleitungsabschnittes werden ent-  
sprechend dem beschriebenen Verfahren über die Einheit 7 in  
die erste Reihe 9 eingelesen und nach der Überprüfung durch  
die erste Vergleichseinheit 20 entsprechend dem beschriebenen  
Verfahren über den zweiten Multiplexer 19 der fünften Reihe  
33 zugeführt.

Die zweite bzw. dritte Vergleichseinheit 31, 32 überprüft, ob  
in mehr als einer vorgegebenen Anzahl von Registern der drit-  
ten bzw. sechsten Reihe 21, 34 Adressen abgespeichert sind.  
Ist dies der Fall, so gibt die zweite bzw. dritte Vergleichs-  
einheit 31, 32 ein entsprechendes Überlaufsignal an die

Recheneinheit 51. Erhält die Recheneinheit 51 ein Überlaufsignal, so überträgt die Recheneinheit 51 die Adresse der gerade überprüften Wort- oder Bitleitung als neue zweite Fehleradresse an die erste Vergleichseinheit 20, die die neue  
5 zweite Fehleradresse in ein freies Register der zweiten Reihe 10 einschreibt. Anschließend löschen die zweite und dritte Vergleichseinheit 31, 32 den Inhalt der Register der dritten, vierten, fünften und sechsten Reihe 21, 22, 33, 34.

Ergibt die Überprüfung durch die zweite oder dritte Vergleichseinheit 31, 32, dass weniger als die vorgegebene Anzahl von Registern der dritten bzw. sechsten Reihe 21, 34 mit Adressen belegt sind, so werden die Adressen, die in den Registern der dritten bzw. sechsten Reihe 21, 34 abgespeichert sind, von der zweiten bzw. dritten Vergleichseinheit 31, 32  
10 in den Speicher 47 übertragen. Dazu sind der zweite Ausgang 42 und der vierte Ausgang 44 an den Speicher 47 angeschlossen.

Ist eine gesamte Speicheranordnung überprüft worden, so gibt die Testvorrichtung 1 ein entsprechendes Endesignal an die  
20 Recheneinheit 51. Daraufhin gibt die Recheneinheit 51 ein entsprechendes Endesignal an die erste Vergleichseinheit 20, die daraufhin alle zweiten Fehleradressen, die in der zweiten Reihe 10 abgespeichert sind, in den Speicher 47 überträgt. Es wird jedoch sichergestellt, dass alle erste Fehleradressen  
25 über den zweiten Multiplexer 19 in die vierte Reihe 32 oder die fünfte Reihe 33 eingelesen und mit den Inhalten der Register der dritten bzw. sechsten Reihe 21, 34 verglichen wurden, bevor das Endesignal an die erste Vergleichseinheit 20 gegeben wird. Dadurch wird gewährleistet, dass ein entsprechend langer Nachlauf bei der Abarbeitung der Adressen  
30 durch die erste und zweite oder dritte Vergleichseinheit 20, 31, 32 durchgeführt wird, so dass alle Adressen von der ersten und zweiten oder ersten und dritten Vergleichseinheit 20, 31, 32 abgearbeitet wurden. Somit sind alle Register 11, 12, 13, 14 der ersten Reihe 9 leer, bevor das Endesignal der  
35

ersten Vergleichseinheit zugeführt wird. Vor dem Zuführen des Endesignals an die zweite und dritte Vergleichseinheit 31, 32 sind alle Register der vierten und fünften Reihe 22, 32 abgearbeitet und deshalb leer.

5 Jedes Register der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Reihe 9, 10, 21, 22, 33, 34 weist eine Bittiefe auf, die der Länge der Adressen der verwendeten Wort- bzw. Bitleitungen entspricht. Die Erfindung wurde anhand von Reihen mit jeweils vier seriell geschalteten Registern be-  
10 schrieben, wobei jedoch jede beliebige Anzahl von Registern in serieller Anordnung verwendet werden kann. Vorzugsweise wird die Anzahl der Register der ersten und zweiten Reihe 9, 10 an die Anzahl der maximal vollständig zu reparierenden Wort- und Bitleitungen angepasst. Werden während einer Über-  
15 prüfung einer Speicheranordnung 3 mehr als die maximal möglich zu reparierenden Wort- und/oder Bitleitungen erkannt, so wird die gesamte Speicheranordnung 3 als defekt gekennzeichnet und aussortiert.

Die Anzahl der Register, die in der dritten, vierten, fünften  
20 und sechsten Reihe 21, 22, 33, 34 seriell geschaltet sind, sind vorzugsweise an die Anzahl der maximal für eine Wort- und/oder Bitleitung zu reparierenden Bit- oder Wortleitungen angepasst. Auf diese Weise wird eine optimale Anpassung der Anzahl der Register pro Reihe erreicht.

25 Die ersten Fehleradressen, die Adressen einer Wort- oder Bitleitung einer fehlerhaften Speicherzelle darstellen und die zweiten Fehleradressen, die Adressen von vollständig zu reparierenden Wort- oder Bitleitungen darstellen, sind im Speicher 47 nach Überprüfung einer Speicheranordnung 3 abge-  
30 speichert und können für eine weitere Verarbeitung oder für weitere Testverfahren entsprechend berücksichtigt werden.

Fig. 2 zeigt einen schematischen Programmablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens, wobei bei Programmpunkt 10 eine

Adresse als erste Fehleradresse ermittelt wird, die über die ausgewählte Wort- bzw. Bitleitung eine Speicherzelle adressiert. Die Adresse besteht in der Wortadresse und der Bitadresse der fehlerhaften Speicherzelle. Sind die Speicherzellen in Form von Speicherzellenblöcken organisiert, die im Falle einer Reparatur gemeinsam ersetzt werden, ist nur eine Wort- und Bitadresse für alle Speicherzellen eines Speicherzellenblocks vorgesehen. Die erste Fehleradresse kann entweder nach Vorgabe einer entsprechenden Adresse einer Wort- und Bitleitung über eine Testvorrichtung 1 von Testschaltungen 61 ermittelt werden, die auf einer Speicheranordnung 3 integriert sind. Jedoch kann auch die Ermittlung der ersten Fehleradresse von der Testvorrichtung 1 selbst durchgeführt werden, indem die Testvorrichtung 1 vorgegebene Testverfahren abarbeitet und das entsprechende Verhalten der Speicheranordnung 3 mit einem vorgeschriebenen Verhalten vergleicht und bei größeren Abweichungen eine Fehlfunktion der adressierten Speicherzelle der Speicheranordnung 3 erkennt. Damit ist eine erste Fehleradresse einer Wort- oder Bitleitung erkannt, die anschließend bei Programmpunkt 20 mit einer ersten Liste von zweiten Fehleradressen verglichen wird. Im gewählten Ausführungsbeispiel ist in der ersten Liste der zweiten Fehleradressen nur eine zweite Fehleradresse abgespeichert. Jedoch kann auch beim Start des Programms die erste Liste noch leer sein. Ergibt der Vergleich bei Programmpunkt 20, dass die erste Fehleradresse nicht mit einer der zweiten Fehleradressen übereinstimmt, so wird nach Programmpunkt 40 verzweigt.

Ergibt der Vergleich bei Programmpunkt 20, dass die erste Fehleradresse mit einer der zweiten Fehleradressen übereinstimmt, so wird beim folgenden Programmpunkt 30 die erste Fehleradresse gelöscht und anschließend zu Programmpunkt 50 verzweigt.

Bei Programmpunkt 40 wird die erste Fehleradresse in eine zweite Liste eines Speichers eingeschrieben. Anschließend er-

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird jeweils ein Wortleitungsabschnitt oder ein Bitleitungsabschnitt auf fehlerhafte Bitleitungen bzw. Wortleitungen überprüft. Dabei wird bei Programmpunkt 50 überprüft, ob alle Wortleitungen  
5 oder Bitleitungen des Wortleitungsabschnittes bzw. Bitleitungsabschnittes überprüft worden sind. Ist dies nicht der Fall, so wird nach Programmpunkt 10 zurückverzweigt und eine neue Bitleitung bzw. eine neue Wortleitung ausgewählt. Ergibt der Vergleich bei Programmpunkt 50, dass alle Bitleitungen  
10 bzw. Wortleitungen des zu überprüfenden Wortleitungsabschnittes bzw. Bitleitungsabschnittes überprüft worden sind und somit alle erste Fehleradressen des Wortleitungsabschnittes bzw. des Bitleitungsabschnittes im Speicher in der zweiten Liste abgelegt sind, dann wird nach Programmpunkt 60 verzweigt. Bei Programmpunkt 60 ermittelt die Recheneinheit die  
15 Anzahl der verschiedenen ersten Fehleradressen des überprüften Wortleitungsabschnittes bzw. Bitleitungsabschnittes.

Bei Programmpunkt 70 überprüft die Recheneinheit, ob die Anzahl der ersten Fehleradressen über einer vorgegebenen Anzahl  
20 liegt. Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt 80 verzweigt. Bei Programmpunkt 80 wird die Adresse des gerade überprüften Wortleitungsabschnittes bzw. Bitleitungsabschnittes als neue zweite Fehleradresse in die erste Liste im Speicher abgelegt, die zweite Liste anschließend gelöscht und daraufhin zu Programmpunkt 10 zurückverzweigt. Bei Programmpunkt 10 wird erneut ein Wortleitungsabschnitt oder Bitleitungsabschnitt ausgewählt und überprüft.

Ergibt die Abfrage bei Programmpunkt 70, dass die Anzahl der ersten Fehleradressen für den Wortleitungsabschnitt oder den  
30 Bitleitungsabschnitt kleiner als die vorgegebene Anzahl ist, so wird zu Programmpunkt 90 verzweigt. Bei Programmpunkt 90 werden die ersten Fehleradressen aus der zweiten Liste ausgelesen und in dem Speicher 47 abgespeichert. Anschließend wird bei Programmpunkt 100 die zweite Liste mit den ersten Fehler-

adressen gelöscht und es wird zu Programmpunkt 10 zurückver-  
zweigt.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist nicht auf das in Fig. 2  
dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt, insbesondere  
5 können Teile des Verfahrens zeitlich parallel abgearbeitet  
werden. Beispielsweise können die Programmschritte 1 bis 50  
für eine neue Adresse abgespeichert werden, während bereits  
für Adressen, die durch die Programmschritte 10 bis 50 gelaufen  
sind, in den Programmschritten 60 bis 100 weiterverarbeitet  
10 werden. Weiterhin ist jede vorteilhafte Konfiguration der  
einzelnen Programmschritte möglich.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird beispielsweise mit einer  
Vorrichtung gemäß Fig. 1 abgearbeitet. Die Anzahl der Fehler-  
adressen, bei denen eine Wort- oder Bitleitung als vollstän-  
15 dig zu reparierende Wort- oder Bitleitung erkannt wird, wird  
individuell an die zu testende Speicheranordnung 3 angepasst.  
Beispielsweise kann für eine Wortleitung eine andere vorgege-  
bene Anzahl als für eine Bitleitung verwendet werden.

Nach dem Überprüfen aller Speicherzellen einer Speicheran-  
20 ordnung werden vorzugsweise die in der ersten Liste abgespei-  
cherten Adressen der vollständig zu ersetzenden Wort- und  
Bitleitungen und die in der dritten Liste im Speicher 47 ab-  
gespeicherten ersten Fehleradressen fehlerhafter Wort- und  
Bitleitungen für weitere Testverfahren abgespeichert, so dass  
25 diese später weiterverwendet werden können. Beispielsweise  
werden die ersten und die zweiten Fehleradressen für eine  
statistische Bewertung einer Vielzahl von getesteten Spei-  
cheranordnungen verwendet. Die Hauptanwendung der ermittelten  
ersten und zweiten Fehleradressen ist die Redundanzkalkula-  
30 tion und die daraus resultierende Ermittlung der durch redun-  
dante Elemente zu ersetzenden Wort- bzw. Bitleitungsab-  
schnitte.

Das Verfahren nach Fig. 2 verwendet als erste Fehleradressen entweder die vollständige Adresse einer Wort- oder Bitleitung oder vorzugsweise die Adresse eines Wortleitungsblockes oder eines Bitleitungsblockes. In einem Wortleitungsblock oder Bitleitungsblock sind mehrere Wort- oder Bitleitungen zusammengefasst, die bei einer Reparatur einer Wort- oder Bitleitung des Wort- bzw. Bitleitungsblockes alle ersetzt werden.

Fig. 3 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer Speicheranordnung mit mehreren Bitleitungen 64 und mehreren Wortleitungen 65. Eine Speicherzelle 66 ist mit einer Wort- und einer Bitleitung 65, 64 verbunden. In diesem Ausführungsbeispiel sind jeweils fünf Wortleitungen 65 zu einem ersten bzw. zweiten Wortleitungsblock 55, 56 zusammengefasst. Weiterhin sind jeweils vier Bitleitungen 64 zu jeweils einem ersten bzw. zweiten Bitleitungsblock 57, 58 zusammengefasst. Die Wortleitungen oder Bitleitungen eines Wortleitungsblockes bzw. eines Bitleitungsblockes werden immer vollständig bei der Reparatur einer Wort- bzw. Bitleitung ersetzt. Somit reicht es aus, wenn für die zwei Bitleitungen des ersten Bitleitungsblockes 57 eine einzige Adresse, eine Bitblockadresse, verwendet wird. Ebenso ist die Verwendung einer einzigen Adresse, einer Wortblockadresse, für zwei Wortleitungen 65 eines Wortleitungsblockes 55, 56 von Vorteil.

Über der Speicheranordnung der Fig. 3 sind schematisch einzelne Bits der Bitleitungsadresse und einzelne Bits der Wortleitungsadresse dargestellt. Mit dem höchstwertigen Bit der Bitleitungsadresse wird eine obere und eine untere Hälfte adressiert. Mit dem zweithöchsten Bit wird jeweils ein oberer Teil der oberen Hälfte und ein unterer Teil der unteren Hälfte der Speicheranordnung adressiert. Ebenso wird mit dem höchstwertigen Bit der Wortleitungsadresse eine linke Hälfte und eine rechte Hälfte der Speicheranordnung adressiert.

Somit ist beispielsweise zur eindeutigen Adressierung des linken oberen Bereiches das höchstwertige Bit und das zweithöchstwertige Bit der Bitleitungsadresse und zudem das höchstwertige Bit der Wortleitungsadresse notwendig. Erst

5 durch die Bitleitungsadresse und die Wortleitungsadresse wird dieser Bitleitungsabschnitt oder Wortleitungsabschnitt eindeutig identifiziert.

Die Erfindung ist nicht auf die im Ausführungsbeispiel beschriebene Vorrichtung und Verfahren beschränkt, sondern kann  
10 auch in anderen Ausführungsformen der Vorrichtung oder des Verfahrens angewendet werden.

Vorzugsweise wird die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren zum Testen von matrixförmig aufgebauten Speicheranordnungen eines Halbleiterspeichers eingesetzt.  
15

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Reduzieren der Anzahl von Adressen, die bei einer Überprüfung von Speicherzellen (66) einer Speicheranordnung abzuspeichern und weiter zu verarbeiten sind, wobei eine Adresse einer Speicherzelle (66), die bei einem Testverfahren als fehlerhaft erkannt wurde, als erste Fehleradresse weiterverarbeitet werden, wobei die erste Fehleradresse in einem ersten Vergleichsverfahren mit einer zweiten Fehleradresse verglichen werden, wobei die zweite Fehleradresse eine Adresse einer vollständig zu reparierenden Wort- und/oder Bitleitung darstellt, wobei bei Übereinstimmung der ersten Fehleradresse mit der zweiten Fehleradresse die erste Fehleradresse nicht abgespeichert und nicht weiterverarbeitet wird, wobei bei Nichtübereinstimmung der ersten und der zweiten Fehleradresse die erste Fehleradresse abgespeichert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten Vergleichsverfahren überprüft wird, ob für eine Wort- oder eine Bitleitung mehr als eine vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen einer Bit- bzw. einer Wortleitung abgespeichert ist, dass die Adresse der Wort- oder Bitleitung, für die mehr als die vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen abgespeichert ist, als weitere neue zweite Fehleradresse erkannt wird und bei folgenden ersten Vergleichsverfahren berücksichtigt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten Vergleichsverfahren überprüft wird, ob für einen Wort- oder einen Bitleitungsabschnitt mehr als eine vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen einer Bit- bzw. einer Wortleitung abgespeichert ist, dass die Adresse des Wort- oder Bitleitungsabschnittes, für die mehr als die vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen abgespeichert ist, als weitere neue zweite Fehleradresse er-

kannt wird und bei folgenden ersten Vergleichsverfahren berücksichtigt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,  
5 dass als erste Fehleradresse eine komplette Adresse einer fehlerhaften Speicherzelle verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgebbare Anzahl für die Wort-  
10 und/oder Bitleitungen bzw. die Wort- und/oder Bitleitungsabschnitte unterschiedlich ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
15 dass als erste und/oder zweite Fehleradresse eine Adresse für mehrere Bitleitungen und/oder Wortleitungen verwendet wird, die in einem Wortleitungsblock bzw. einem Bitleitungsblock liegen, der bei einer Reparatur vollständig ersetzt wird.

20 7. Vorrichtung zum Reduzieren der Anzahl von Adressen fehlerhafter Speicherzellen mit einer Recheneinheit (51, 20, 31, 32), die einen Speicher (9, 10, 21, 22) aufweist, wobei die Recheneinheit (51, 20, 31, 32) Adressen von Speicherzellen (66), die bei einem Testverfahren als fehlerhaft  
25 erkannt wurden, als erste Fehleradressen weiterverarbeitet, wobei die Recheneinheit (51, 20, 31, 32) die ersten Fehleradressen in einem ersten Vergleichsverfahren mit zweiten Fehleradressen vergleicht,  
wobei die zweiten Fehleradressen Adressen von vollständig zu  
30 reparierenden Wort- und/oder Bitleitungen darstellen, wobei bei Übereinstimmung der ersten Fehleradresse mit der zweiten Fehleradresse die Recheneinheit (51, 20, 31, 32) die erste Fehleradresse nicht abspeichert,  
wobei bei Nichtübereinstimmung der ersten und der zweiten  
35 Fehleradresse die Recheneinheit die erste Fehleradresse abspeichert.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (51, 20, 31, 32) in einem zweiten Vergleichsverfahren überprüft, ob für eine Wort- oder eine Bitleitung mehr als eine vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen von Bit- bzw. Wortleitungen abgespeichert ist, wobei die Recheneinheit (51, 20, 31, 32) die Adresse der Wort- oder Bitleitung, für die mehr als die vorgegebene Anzahl von ersten Fehleradressen abgespeichert sind, als neue weitere zweite Fehleradresse abspeichert und bei folgenden ersten Vergleichsverfahren berücksichtigt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (51, 20, 31, 32) eine erste Vergleichseinheit (20) aufweist, wobei die erste Vergleichseinheit (20) eine erste Reihe (9) und eine zweite Reihe (10) von seriell geschalteten Registern aufweist, wobei jeweils ein Register der ersten Reihe (9) einem Register der zweiten Reihe (10) zugeordnet ist, wobei die erste Vergleichseinheit (20) einen Takteingang (36) aufweist, über den der ersten Vergleichseinheit (20) ein Taktsignal zugeführt wird, wobei einem ersten Register (11) der ersten Reihe (9) eine erste Fehleradresse zuführbar ist, wobei die erste Fehleradresse bei jedem Taktsignal um ein Register in der ersten Reihe (9) weiterverschoben wird, wobei die Vergleichseinheit (20) zwischen den Taktsignalen jeweils die Adressen der zugeordneten Register der ersten und der zweiten Reihe (9, 10) vergleicht und die Adresse des Registers der ersten Reihe (9) löscht, wenn die Adressen übereinstimmen.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit eine zweite Vergleichseinheit (31) aufweist,

wobei die zweite Vergleichseinheit (31) eine dritte Reihe (21) und eine vierte Reihe (22) von seriell geschalteten Registern aufweist,  
wobei jeweils ein Register der dritten Reihe (21) einem Register der vierten Reihe (22) zugeordnet ist,  
5 wobei die zweite Vergleichseinheit (31) einen Takteingang (36) aufweist, über den der zweiten Vergleichseinheit (31) ein Taktsignal zugeführt wird,  
wobei einem ersten Register der vierten Reihe (22) nach dem  
10 Taktsignal eine erste Fehleradresse zuführbar ist,  
wobei die erste Fehleradresse bei jedem Taktsignal um ein Register in der dritten Reihe (22) weiterverschoben wird,  
wobei die zweite Vergleichseinheit (31) zwischen den Taktsignalen jeweils die Adressen der zugeordneten Register (23,  
15 27) miteinander vergleicht,  
wobei die zweite Vergleichseinheit (31) die Adresse des Registers (27) der vierten Reihe (22) löscht, wenn die Adressen übereinstimmen,  
wobei die zweite Vergleichseinheit die Adresse des Registers  
20 der vierten Reihe (22) in das zugeordnete Register der dritten Reihe (21) einliest, wenn das zugeordnete Register der dritten Reihe (21) beim Vergleich als leer erkannt wird,  
wobei die zweite Vergleichseinheit (31) die ersten Fehleradressen einer Wort- und/oder Bitleitung in einem Arbeitsgang  
25 der Reihe nach in die erste Reihe einliest und verarbeitet,  
wobei die zweite Vergleichseinheit (31) nach dem Arbeitsgang überprüft, ob mehr als eine vorgegebene Anzahl von Registern der dritten Reihe (21) belegt sind,  
wobei die Recheneinheit (51) die Adresse der überprüften  
30 Wort- oder Bitleitung als weitere neue zweite Fehleradresse in ein freies Register der zweiten Reihe (10) einschreibt.

## Zusammenfassung

### Vorrichtung und Verfahren zum Reduzieren der Anzahl von Adressen fehlerhafter Speicherzellen

Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Reduzieren von Adressen fehlerhafter Speicherzellen beschrieben, bei dem die Adressen fehlerhafter Speicherzellen als erste Fehleradressen mit Adressen vollständig zu reparierender Wort- oder Bitleitungen, so genannter zweiter Fehleradressen, verglichen werden. Bei Übereinstimmung der ersten Fehleradresse mit der zweiten Fehleradresse wird die erste Fehleradresse gelöscht und nicht weiterbearbeitet. In einem zweiten Vergleichsverfahren wird anhand der Anzahl der nicht gelöschten ersten Fehleradressen festgelegt, ob eine Adresse einer Wort- oder Bitleitung als neue zweite Fehleradresse für das erste Vergleichsverfahren verwendet wird. Aufgrund des beschriebenen Verfahrens wird eine Reduzierung der Adressen fehlerhafter Speicherzellen erreicht.

Fig. 1

# Figur für die Zusammenfassung

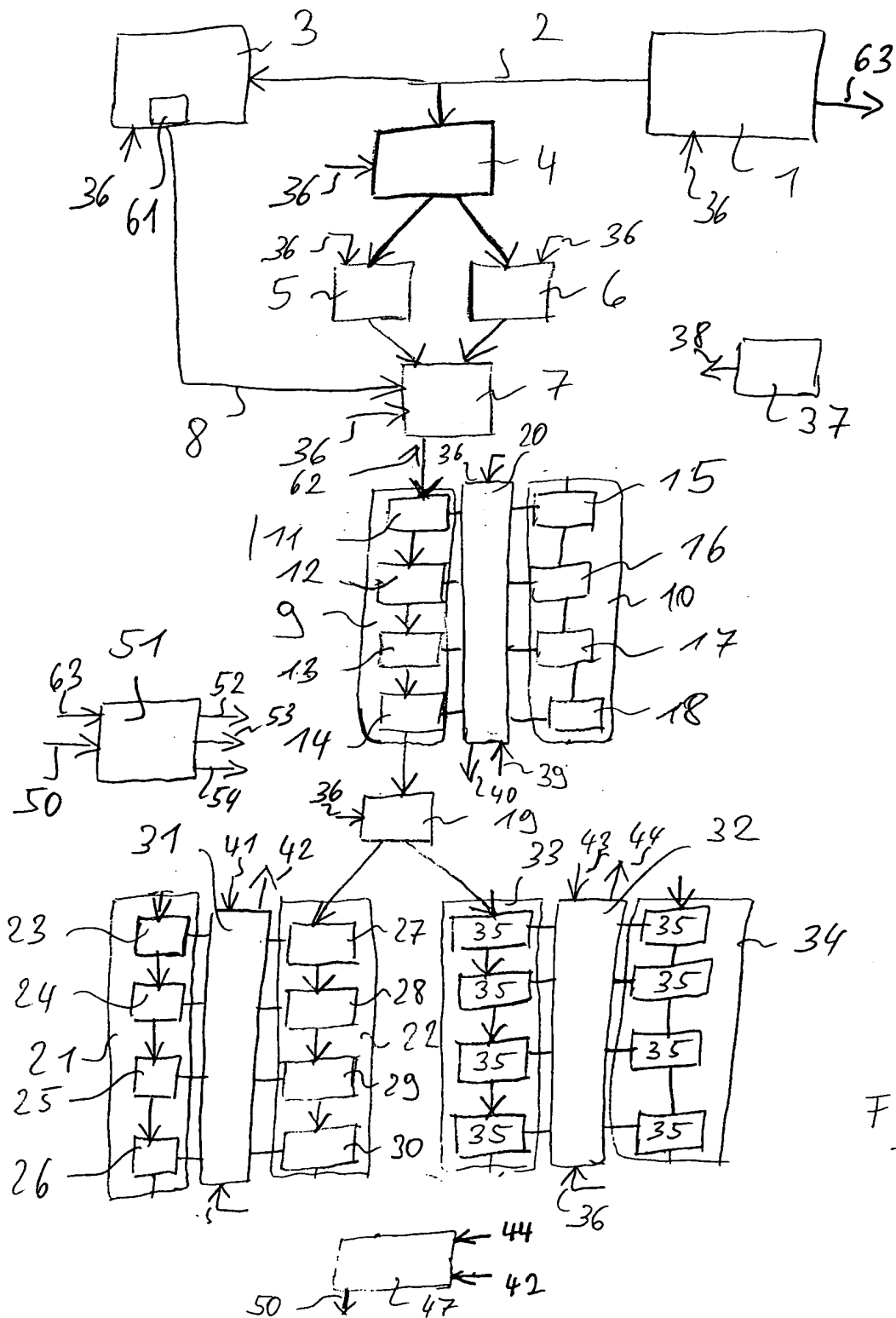


FIG. 1

## Bezugszeichenliste

	1	Testvorrichtung
	2	Testleitung
	3	Speicheranordnung
5	4	erster Multiplexer
	5	erstes Adressregister
	6	zweites Adressregister
	7	Auswahleinheit
	8	erste Ausgangsleitung
10	9	erste Reihe
	10	zweite Reihe
	11	erstes Register, erste Reihe
	12	zweites Register, erste Reihe
	13	drittes Register, erste Reihe
15	14	viertes Register, erste Reihe
	15	fünftes Register, zweite Reihe
	16	sechstes Register, zweite Reihe
	17	siebtes Register, zweite Reihe
	18	achtes Register, zweite Reihe
20	19	zweiter Multiplexer
	20	erste Vergleichseinheit
	21	dritte Reihe
	22	vierte Reihe
	23	dreizehntes Register, dritte Reihe
	24	vierzehntes Register, dritte Reihe
	25	fünfzehntes Register, dritte Reihe
	26	sechzehntes Register, dritte Reihe
	27	neuntes Register, vierte Reihe
	28	zehntes Register, vierte Reihe
30	29	elftes Register, vierte Reihe
	30	zwölftes Register, vierte Reihe
	31	zweite Vergleichseinheit
	32	dritte Vergleichseinheit
	33	fünfte Reihe
35	34	sechste Reihe
	35	Register

	36	Takteingang
	37	Taktgenerator
	38	Taktausgang
	39	erster Eingang
5	40	erster Ausgang
	41	zweiter Eingang
	42	zweiter Ausgang
	43	dritter Eingang
	44	dritter Ausgang
10	47	Speicher
	50	Datenleitung
	51	Recheneinheit
	52	siebter Ausgang
	53	achter Ausgang
15	54	neunter Ausgang
	55	erster Wortleitungsblock
	56	zweiter Wortleitungsblock
	57	erster Bitleitungsblock
	58	zweiter Bitleitungsblock
20	61	Testschaltung
	62	zwölfter Ausgang
	63	achter Eingang
	64	Bitleitung
	65	Wortleitung
25	66	Speicherzelle

1/3

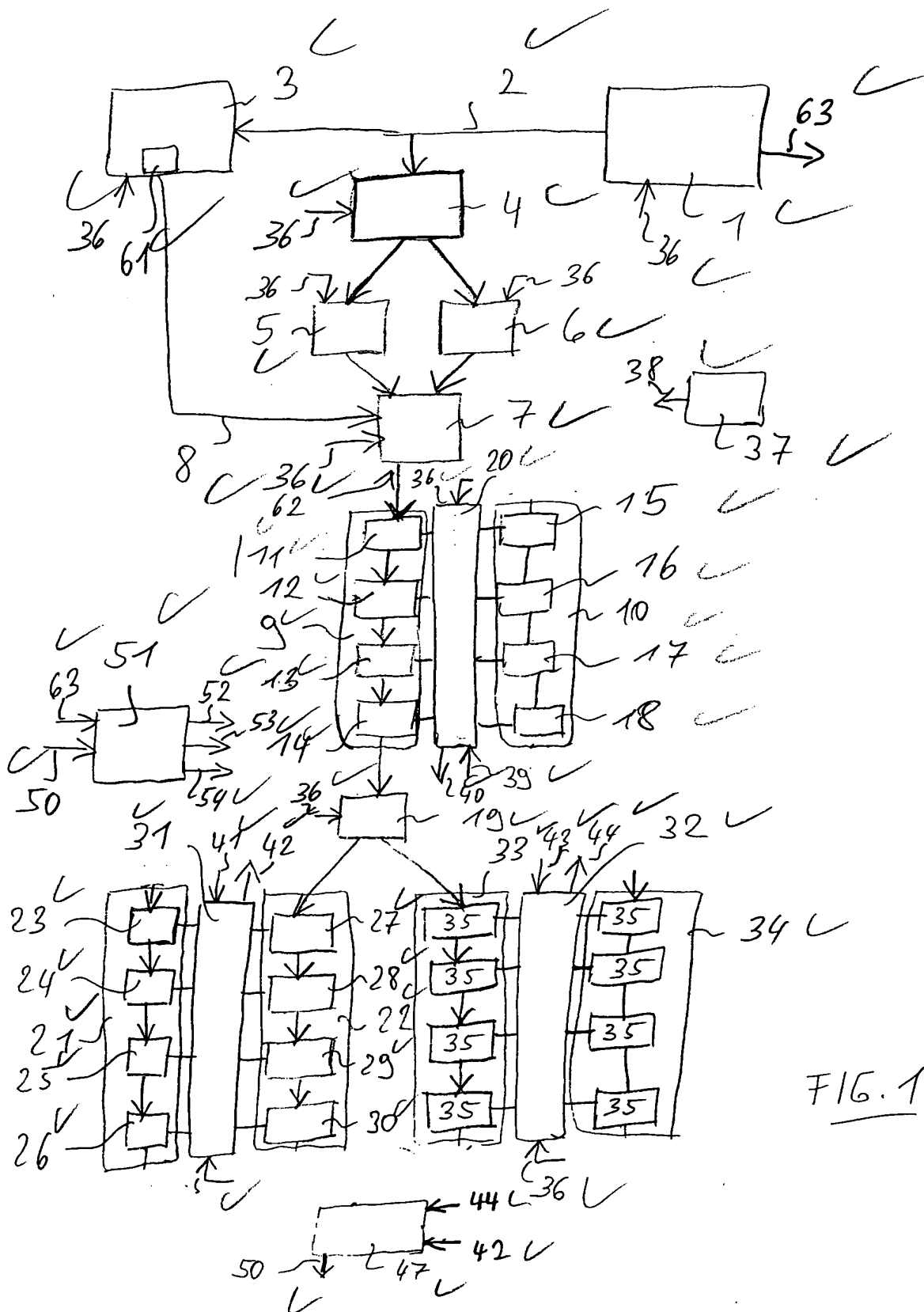


FIG. 1

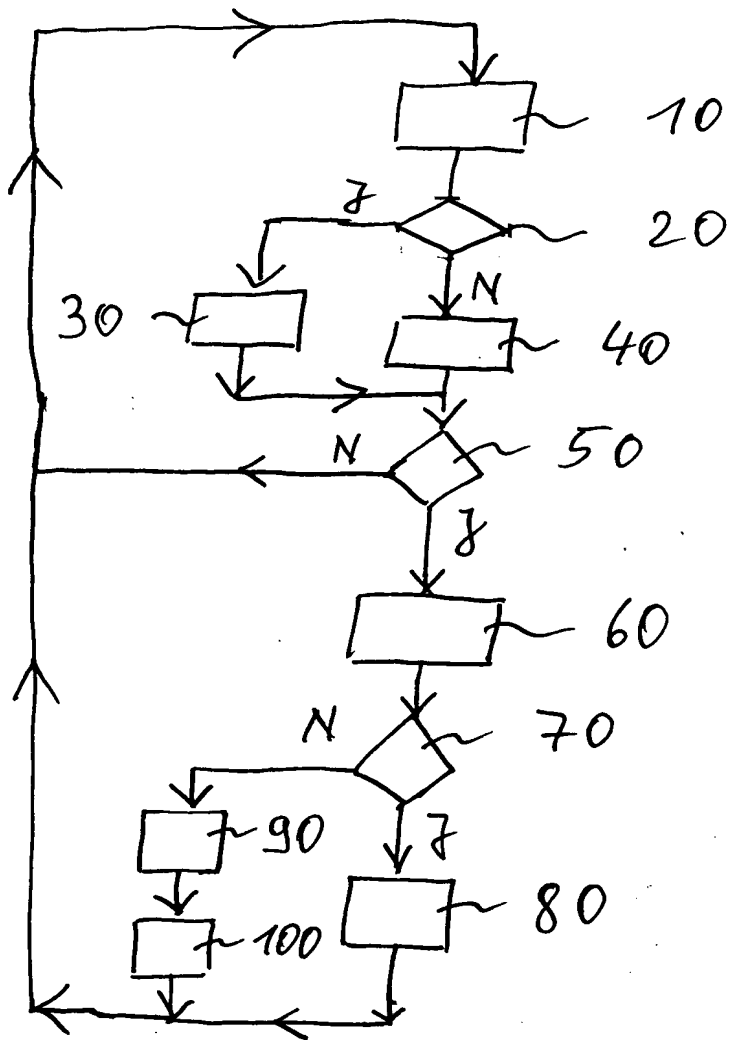
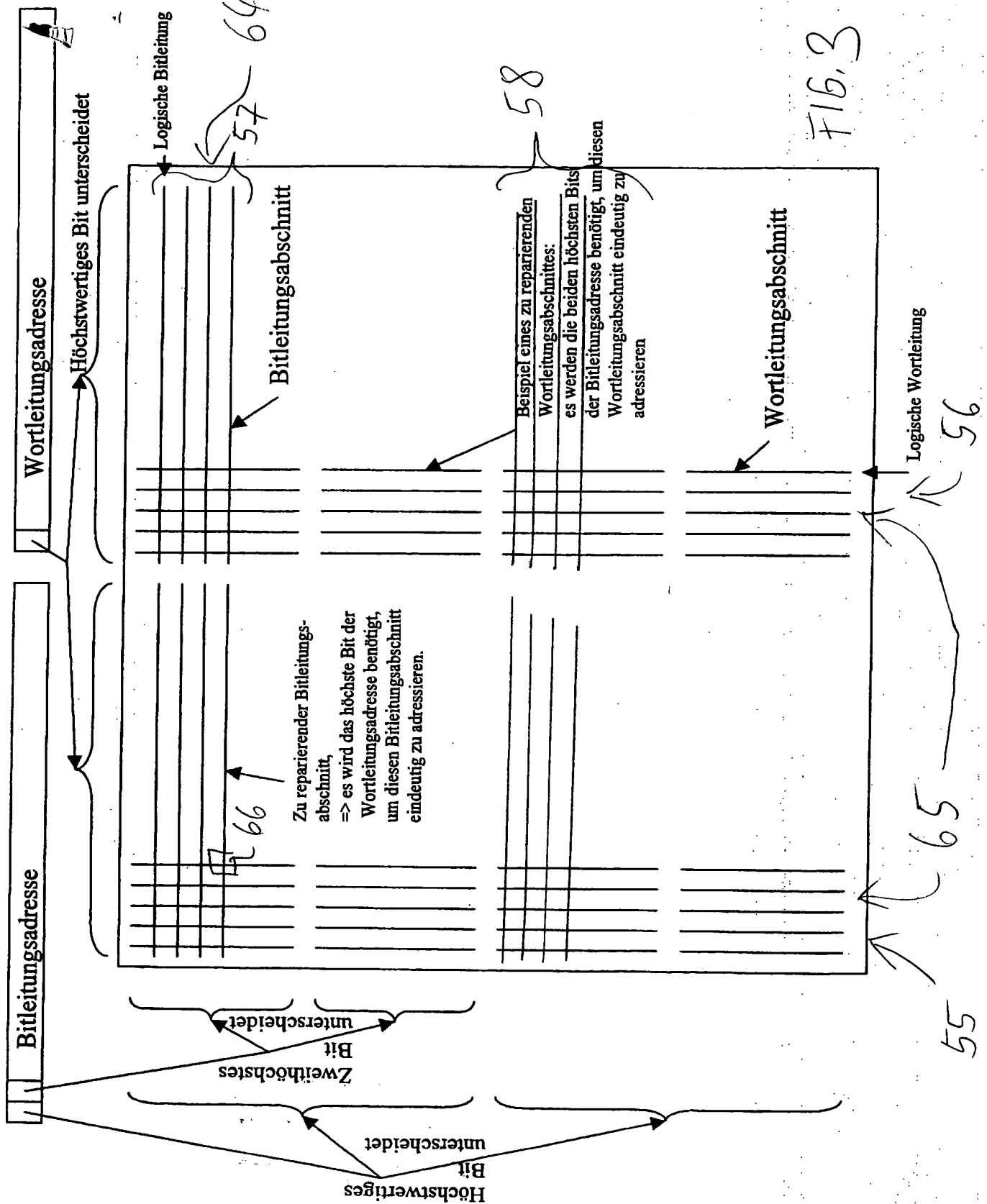


FIG. 2





Creation date: 09-29-2004  
Indexing Officer: TLAM2 - THY LAM  
Team: OIPEBackFileIndexing  
Dossier: 10412979

Legal Date: 04-14-2003

No.	Doccode	Number of pages
1	FRPR	17

Total number of pages: 17

Remarks:

Order of re-scan issued on .....